

供媒體即時發佈

投資者關係：

Ed Lockwood

投資者關係資深總監

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

媒體關係：

Meggan Powers

企業宣傳資深總監

(408) 875-8733

meggan.powers@kla-tencor.com

KLA-Tencor™ 宣佈推出用於基板製造和積體電路製程監測的

新型 Surfscan® SP3 缺陷與表面品質檢測系統

獨有的深紫外光檢測靈敏度、業內領先的檢測通量

-促進了 28 奈米及以下節點積體電路的製造

【加州 MILPITAS 2011 年 7 月 11 日訊】今天，[KLA-Tencor Corporation™ \(NASDAQ: KLAC\)](#) 宣佈推出新一代的 Surfscan® 系列晶圓缺陷與表面品質檢測系統——Surfscan SP3。Surfscan SP3 系統是首款採用深紫外 (DUV) 光照的無圖案晶圓檢測平台，與被視為業界基準的前身 Surfscan SP2^{XP} 相比，檢測靈敏度與檢測生產量均大幅提升。Surfscan SP3 平台的檢測範圍還可擴展到下一個晶圓尺寸——450 毫米。

KLA-Tencor 資深副總裁兼 Surfscan / ADE 業務部總經理 Ali Salehpour 表示：「推出新款的 Surfscan 平台是 KLA-Tencor 的一件大事。使用可見光的 Surfscan SP1 和使用紫外光照的 Surfscan SP2 在業界廣泛被接受；實際上，每一家處於領先地位的基板與晶片製造廠都使用 Surfscan 工具。如今，我們即將推出第一款採用深紫外光照的無圖案晶圓檢測平台，以滿足業界對以高產量檢測 28 奈米及以下節點之晶片的需要。我們相信，Surfscan SP3 一定會使 Surfscan 作為基板與積體電路製程之卓越檢測工具的聲譽提升到更高的水準。」

Surfscan SP3 系統旨在幫助開發和製造 28 奈米及以下級晶片所用的基板，使其幾乎原子般地光滑且沒有拋光痕跡、晶體凹坑、凸起、空隙或其他破壞電晶體之電子完整性的缺陷。由於當前這一代檢測系統無法以生產速度可靠地偵測出這些缺陷，所以基板製造商難以在這些頂級、更小節點的晶圓上提供令人滿意的良率。KLA-Tencor 工程師們研製的 Surfscan SP3 檢測系統的深紫外光靈敏度與檢測通量能夠在基板製造期間可靠地線上識別關鍵的缺陷及表面品質問題。

在積體電路廠，製造商們還必須能夠監測經過沉積和化學機械拋光 (CMP) 後的粗糙和光滑無圖案薄膜，以確保製程工具不會使缺陷增多。Surfscan SP3 運用其獨有的深紫外波長、特殊光圈及多光照與採集通道來滿足以生產速度對覆膜進行缺陷偵測和分級的 28 奈米節點之嚴格要求。SP3 還有一個模組可以檢測晶圓背面可能在光刻期間使晶圓變形的缺陷。

與當前一代的 Surfscan 平台相比，Surfscan SP3 新增並改進了以下各功能與特點：

- 強大的深紫外光源與經過深紫外優化的光學元件，有助於偵測影響 28 奈米及以下節點之晶片的關鍵缺陷；
- 新的機台與新的影像處理電腦，與演算法的改進共同提升了生產通量；
- 深紫外光特定的光圈，增強了偵測覆膜上缺陷的能力；
- 一體化、高解析度 (約 100 兆圖元)、全晶圓 SURFmonitor™ 霧度圖，可以自動偵測超細微的滑移線條和刮痕，或描繪出表面粗糙度、粒度尺寸和其他製程參數的圖形；
- 缺陷座標精度改進，增強了在 KLA-Tencor 之 eDR 電子束復查工具上進行缺陷復查與分級的再次偵測率與速度，從而讓工程師們能夠快速追查到缺陷偏移的來源並對晶圓進行準確的處理。

Surfscan SP3 工具可以相互搭配並與工廠現有的 Surfscan SP2 和 SP2^{XP} 基線工具進行關聯，以提升工具組合的靈活性及工廠的產能。為了保持高效能和高產能，Surfscan SP3 工具由 [KLA-Tencor 的全球綜合服務網路](#) 提供支援。

Surfscan SP3 系統已經開始向亞洲、美國和歐洲的領先基板與晶片製造商供貨，用於先進的開發與生產線。關於 KLA-Tencor 的無圖案晶圓缺陷檢測系統的更多資訊，請參觀產品網頁：<http://www.kla-tencor.com/front-end-defect-inspection/surfscan-series.html>。

KLA-Tencor 公司簡介：

KLA-Tencor Corporation (納斯達克股票代碼：KLAC) 是製程控制與良率管理解決方案的領先提供商，它與全球客戶合作，開發先進的檢測與度量技術。這些技術為半導體、資料儲存、LED、光電及其他相關奈米電子產業提供服務。公司擁有廣泛的業界標準產品系列及世界一流的工程師與科學家團隊，三十餘年來為客戶努力打造優秀的解決方案。KLA-Tencor 的總部設在美國加利福尼亞州 Milpitas，並在全球各地設有專屬的客戶營運與服務中心。如需更多資訊，請參觀網站 www.kla-tencor.com。(KLAC-P)

前瞻性聲明：

本新聞稿中除歷史事實以外的聲明，例如關於 Surfscan SP3 的預期效能，半導體產業的趨勢（及其帶來的預期挑戰），KLA-Tencor 的客戶對 Surfscan SP3 的預期使用，Surfscan 平台在提供新功能方面的預期可擴展性，以及 Surfscan SP3 工具使用者可以實現的預期成本、營運與其他受益等陳述，均為前瞻性聲明，並受到《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 規定的「安全港」(Safe Harbor) 條款的制約。這些前瞻性聲明基於當前資訊及預期，且包含諸多風險與不確定性。由於各種因素，包括延遲採用新技術（無論是由於成本或效能問題抑或其他問題），其他公司推出競爭性產品，

或影響 KLA-Tencor 產品的實現、效能或使用的意外技術挑戰或限制，因此實際結果可能與此類聲明中的預計結果不同。

###